

# 分析测试中心关于举办场发射透射电子显微镜（TEM）操作 培训通知

分析测试中心新进的日本电子 JEM-F200 场发射透射电子显微镜配置冷场发射电子枪，分辨率可达 0.1nm。配有双探头能谱探测器（探头面积 200 mm<sup>2</sup>），可在任意样品倾角下实现快速精准的微区成分分析，目前已正常运行半年（仪器参数见附件 1）。为提高大型仪器设备开放共享使用效率，全面满足校内广大师生的需求，分析测试中心针对有较大 TEM 表征需求的师生开展操作培训，具体安排如下：

## 一、培训内容

场发射透射电子显微镜（型号：JEOL JEM-F200）的操作技术。

## 二、培训人员

需要独立上机操作透射电子显微镜的人员（每课题组最多限 2 人报名）。

## 三、培训及认证方式

集中培训和单独上机操作相结合，经考核通过后，认证为自测用户，可在非工作时间预约测试，且享受测试费用优惠。

## 四、报名方式及时间安排

1. 征得导师同意，阅读并签署《学生导师知情书（JEM-F200）》（见附件 2）；
2. 扫描“JEM-F200 透射电镜培训群-202502”二维码加入群聊，群昵称修改为姓名-学院名称-导师姓名；
3. 报名截止时间为 2 月 23 日。

## 五、培训时间

根据报名情况另行在微信群中通知，计划 2 月下旬开始。

## 六、联系方式

曾钰耀 15320037767

分析测试中心  
2025 年 2 月 17 日

群聊: JEM-F200透射电镜  
培训群-202502

